

第三章 选择

3.1 练习

Problem 3.1.1

给出一个算法，使得在最坏情况下，它能够只利用六次比较来找出五个元素的中间值。描述该算法的步骤，但不需要写出代码。利用决策树图的形式给出你的算法。决策树是一棵二叉树，每个内部节点代表一次比较“ $A[i] : A[j]$ ”，每个叶子节点代表的是数组中元素。

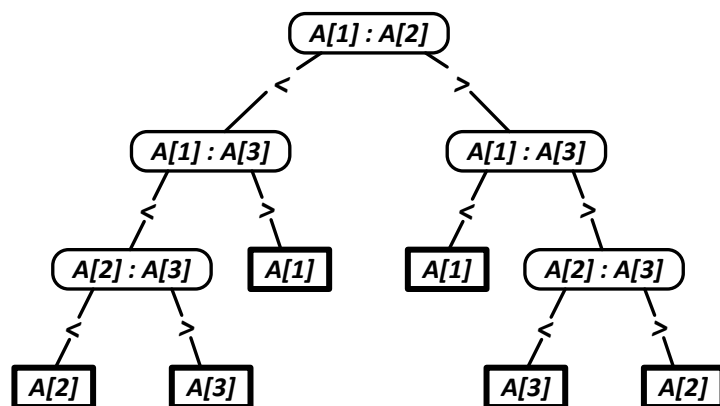


图 3.1: 至多用三次比较找出三个不同元素的中值

Problem 3.1.2

- (a) 给定两个有序数组 $A[1..n]$, $B[1..n]$ 和一个整数 k ，请给出算法用 $O(\log n)$ 的时间找到 $A \cup B$ 中的第 k 小的元素。如果 $k = 1$ ，算法得到的应当是 $A \cup B$ 中最小的元素；如果 $k = n$ ，算法得到的应当是 $A \cup B$ 的中值。你可以假设数组中没有重复元素。（提示：先解决 $k = n$ 这种特殊情况。）
- (b) 给定三个有序数组 $A[1..n]$, $B[1..n]$, $C[1..n]$ 和一个整数 k ，请给出算法用 $O(\log n)$ 的时间找到 $A \cup B \cup C$ 中第 k 小的元素。
- (c) 给定二维数组 $A[1..m][1..n]$ ，数组的每一行都是有序的和有一个整数 k 。请给出一个算法用尽可能短的时间找到数组中第 k 小的元素，并给出算法的时间复杂度。

Problem 3.1.3

假设对一个含有 n 个元素的集合，某算法只用比较来确定第 i 小的元素。证明：无需另外的比较操作，它也能找到比第 i 小的元素小的 $i - 1$ 个元素和比第 i 小的元素大的 $n - i$ 个元素。

Problem 3.1.4

假设已有一个用于选择中位数的“黑盒”算法 \mathcal{A} ，它在最坏情况下需要线性运行时间。请给出基于已有的黑盒算法 \mathcal{A} ，选择任意第 k 小元素的算法 \mathcal{B} ，要求算法 \mathcal{B} 最坏情况下也是线性时间的。

Problem 3.1.5 (动态发现中值)

请设计一个数据结构支持对数时间复杂度的插入操作，常数时间发现中值，对数时间删除中值。（提示：利用1个最小堆和1个最大堆。）

3.2 问题

Problem 3.2.1 (k Largest Numbers)

给定有 n 个数的集合，现要求找出其中的前 k 大的 k 个数（得出的这 k 个数是排好序的，即知道哪个是第1大，第2大， \dots ，第 k 大），请设计三个基于比较的算法，并使得算法的最坏时间复杂度分别符合下面三个要求：

- (a) $O(n \log n)$
- (b) $O(n + k \log n)$
- (c) $O(n + k \log k)$

Problem 3.2.2

有 n 个项组成的数组 $R[1 \dots n]$ ，唯一可以对 R 进行的操作是 $Check(R[i], R[j])$ ，返回 True，如果 $R[i]$ 和 $R[j]$ 相等；返回 False，如果 $R[i]$ 和 $R[j]$ 不等。对于一个有 n 个项的数组 R ，如果至少有 $\frac{n}{13}$ 项同项 e 相等，那么 e 被称为常见项，我们希望设计一个使用 $O(n \log n)$ 个 Check 操作调用的算法返回所有常见项。

- (a) 证明 R 中存在最多 13 个不同的常见项。
- (b) 设 e 是 $R[1 \dots n]$ 中的常见项，证明 e 至少是 $R[1 \dots \frac{n}{2}]$ 和 $R[\frac{n}{2} + 1 \dots n]$ 两个数组中一个数组的常见项。
- (c) 通过分治法找到 $R[1 \dots n]$ 中所有的常见项。
- (d) 常见项定义中的 13 换为任意大于等于 2 的正整数 k ，算法是否还正常工作？
- (e) 当上述常数 k 被设定为常数 2 时（即要求找到出现次数至少有 $\frac{n}{2}$ 的项），是否有更高效的算法解决该问题？

Problem 3.2.3

给定一个有 n 个不同正数的集合 S ，用 M 表示 S 的中值。请设计算法找出 S 中和 M 的大小最接近的 k 个数（ k 远小于 n ）。例如，集合 $S = \{6, 7, 50, 800, 900\}$ ，中值 M 是 50，两个（ $k = 2$ ）和中值 M 最接近的数是 6 和 7。

- (a) 给出时间复杂度为 $O(n \log n + k)$ 的算法。
- (b) 给出时间复杂度为 $O(n + k \log k)$ 的算法。

Problem 3.2.4

现有 n 个互不相同的数 x_1, x_2, \dots, x_n ，每个数都有一个非负权重， w_1, w_2, \dots, w_n ，并且满足 $\sum_{1 \leq i \leq n} w_i = 1$ ，其中被称之为加权中位数的数 x_k 必须满足不等式

$$\sum_{x_i < x_k} w_i < \frac{1}{2}, \quad \sum_{x_i > x_k} w_i \leq \frac{1}{2}$$

- (a) 证明当 $w_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 时， x_1, x_2, \dots, x_n 的中值即加权中位数。
- (b) 请给出用基于排序的方法找出加权中位数的算法，并且最坏时间复杂度满足 $O(n \log n)$ 。
- (c) (选做) 请给出最坏时间复杂度为 $\Theta(n)$ 的找到加权中位数的算法。

Problem 3.2.5

*Diogenes*教授有 n 个被认为是完全相同的VLSI芯片，原则上它们是互相测试的。教授的测试装置一次可测二片，当该装置中放有两片芯片时，每一片就对另一片测试并报告其好坏。一个好的芯片总能够报告另一片的好坏，但一个坏的芯片的结果是不可靠的。这样，每次测试的四种可能结果如下：

A芯片报告	B芯片报告	结论
B是好的	A是好的	都是好的，或都是坏的
B是好的	A是坏的	至少一片是坏的
B是坏的	A是好的	至少一片是坏的
B是坏的	A是坏的	至少一片是坏的

- (a) 证明若多于 $n/2$ 个芯片是坏的，在这种成对测试方式下，使用任何策略都不能确定哪个芯片是好的。假设坏的芯片可以联合起来欺骗教授。
- (b) 假设有多于 $n/2$ 个芯片是好的，考虑从 n 片中找出一片好芯片的问题。证明 $\lfloor n/2 \rfloor$ 对测试就足以使问题的规模降至近原来的一半。
- (c) 假设有多于 $n/2$ 个芯片是好的，证明好的芯片可用 $\Theta(n)$ 对测试找出。给出并解答表达测试次数的递归式。